

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 15.11.2013 faxen an
(030) 63 92-65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Spätmeldung Poster ja nein

Titel des Vortrages/Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

180,00 €, Studenten 20,00 €

Überweisung an: IAP e.V.

Konto-Nr. 102 000 5920, Deutsche Kreditbank AG Berlin, BLZ 120 300 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 125,00 €/m²

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 64,00 € für ein EZ bzw. 76,00 € für ein DZ
zzgl. 12,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Es ist ein begrenztes Zimmerkontingent zu den genannten Preisen verfügbar. Nach Ausschöpfung des Kontingents werden nach Rücksprache ggf. teurere Zimmer gebucht. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

IAP Institut für angewandte
Photonik e.V., Berlin
IfG – Institute for Scientific
Instruments GmbH, Berlin
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Helmut-Fischer-Stiftung, Stuttgart
Optec Berlin-Brandenburg e.V.
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin
Arbeitskreis Prozessanalytik
SPECTRO Analytical Instruments
GmbH, Kleve
Technische Universität Berlin
TSB – Technologiestiftung, Berlin
VDI/VDE – Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik (GMA)
VDI-Bezirksgruppe Adlershof
WISTA-MANAGEMENT GMBH

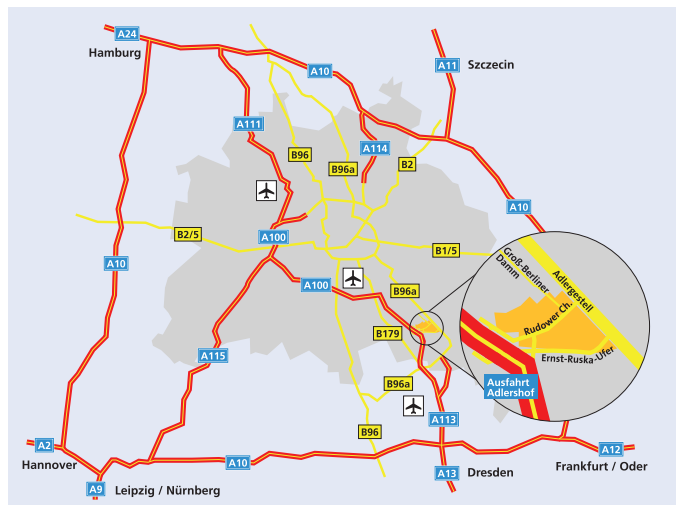
Organisation und Korrespondenzanschrift

Frau I. Kaiser (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
Frau D. Zimani (Sekretariat IAP e.V.
und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92-65 00
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31, 12489 Berlin
Fax: (030) 63 92-65 01
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
G. Bruno, BAM, Berlin und Universität
Potsdam
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
N. Esser, ISAS, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg
B. Kanngießer, TU Berlin
A. Kharchenko, PANalytical,
Almelo, Niederlande
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, Spectro Analytical
Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM, Berlin
U. Panne, BAM und HU Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative
Technologies
V. Röbiger, Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Mess-
technik, Sindelfingen
Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
H. Stiel, MBI, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin
U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH,
Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter
www.adlershof.de

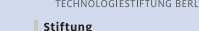


PRORA 2013

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

21. und 22. November 2013

im WISTA – Wissenschafts-
und Technologiepark Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



- 10.00–10.20 Eröffnung
*H. Schmitz (WISTA Management GmbH),
F. Lerch (OptecBB), R. Wedell (IAP e.V.)*
- 10.20–10.55 *M. Maiwald (BAM) (E)*
**100 Jahre Prozessanalytik –
Vom Pfeifenanalysator zur wissensbasierten Produktion**
- 11.00–12.10 **Applikationen in der Industrie**
Leitung: R. Wedell
- 11.00–11.30 *B. Nensel (Helmut Fischer GmbH) (E)*
Prozesskontrolle von mikrostrukturierten Proben mit Röntgenfluoreszenz
- 11.30–11.50 *J. Piltz (amtec Analysenmesstechnik GmbH)*
Die Steuerung von Prozessen mittels RFA-Messsystemen
- 11.50–12.10 *D. Langbein u.a. (ThyssenKrupp Steel Europe AG)*
Mobile Röntgenfluoreszenzspektrometer in der betrieblichen Praxis
- 12.15–13.25 Mittagspause
- 13.30–15.00 **Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte**
Leitung: B. Beckhoff
- 13.30–14.00 *A. Erko (HZB / BESSY) (E)*
Novel X-Ray Systems for Spectroscopy and Monochromators
- 14.00–14.20 *R. Unterumsberger u.a. (PTB)*
Fokussierung weicher Röntgenstrahlung mit einer Monokapillare für Nanoanalytik mit einem wellenlängendispersiven Spektrometer
- 14.20–14.40 *P. Pennartz u.a. (Rigaku Innovative Technologies)*
Recent developments for X-Ray optics
- 14.40–15.00 *S. Bjeoumikhova u.a. (IFG Institute for Scientific Instruments GmbH)*
Charakterisierung von Röntgenkapillaroptiken für die μ -RFA
- 15.00–15.25 Kaffeepause
- 15.30–16.50 *Leitung: N. Langhoff*
- 15.30–15.50 *M. Gerlach (PTB)*
Charakterisierung und Einsatz von HAPG-Kristallen für hochauflösende Spektrometrie mit Synchrotronstrahlung
- 15.50–16.10 *L. Anklamm u.a. (TU Berlin)*
Laboratory based XES for chemical speciation with a novel von Hamos type spectrometer

- 16.10–16.30 *C. Michaelsen (Incoattec GmbH)*
Use of metal-jet sources with multilayer optics for X-Ray diffraction and scattering experiments
- 16.30–16.50 *R. Gubzhokov u.a. (IFG Institute for Scientific Instruments GmbH)*
WDX-Spektrometer mit Fresneloptiken
- 16.50–17.05 Pause
- 17.10–18.10 *Leitung: M. Ostermann*
- 17.10–17.30 *U. Häusler (Bundesamt für Strahlenschutz)*
Bauartzulassungen von technischen Röntgeneinrichtungen
- 17.30–17.50 *M. Krämer u.a. (AXO Dresden GmbH)*
Entwicklung und Charakterisierung von neuartigen Kalibrierproben für die RFA
- 17.50–18.10 *V. Rackwitz u.a. (BAM)*
Neue Referenz- und Testmaterialien sowie Prozeduren zur Funktionskontrolle und Spezifizierung von energiedispersiven Röntgenspektrometern
- 18.15–19.30 **Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung**
Leitung: V. Rößiger
- 19.30 gemeinsames Abendessen

- 8.30–10.10 **Methodische Probleme der Prozessanalytik**
Leitung: H. Miersch
- 8.30–9.00 *P. Brouwer (PANalytical B. V.) (E)*
Use of Clustering and Principal Component Analysis for material identification with XRF
- 9.00–9.20 *D. Porta (Bruker AXS GmbH)*
Neue Konzepte für die Metallanalytik: Kombination WD-XRF / ED-XRF / OES
- 9.20–9.50 *J. Kessler u.a. (Helmut Fischer GmbH)*
Automatische Probenpositionierung in der XRF mittels Bilderkennung
- 9.50–10.10 *A. Kühn u.a. (IAP Institut für Angewandte Photonik e. V.)*
Prozessüberwachung bei der thermischen Aufarbeitung zur Phosphorrückgewinnung mittels RFA und LIBS
- 10.10–10.25 Kaffeepause
- 10.30–12.00 *Leitung: U. Waldschläger*
- 10.30–11.00 *A. Renno u.a. (HIF) (E)*
Bulk and spatially resolved chemical on-line analytics in mineral-processing – a rocky road to success?
- 11.00–11.20 *I. Holfelder u.a. (PTB)*
EEM1450 – Komplementäre Analytik für 450 mm Wafer
- 11.20–11.40 *D. Wissmann u.a. (SPECTRO Analytical Instruments GmbH)*
Portable Röntgenfluoreszenzanalyse zur Vor-Ort-Untersuchung von geologischen Proben
- 11.40–12.00 *S. Nowak u.a. (IFG Institute for Scientific Instruments GmbH)*
Full field PIXE analysis of geological samples
- 12.00–13.00 Mittagspause
- 13.00–14.10 **Neue röntgenanalytische Methoden**
Leitung: B. Kanngießner
- 13.00–13.30 *J. Grenzer u.a. (HZDR) (E)*
GISAXS-Messungen am Labor-Diffraktometer
- 13.30–13.50 *C. Streeck u.a. (PTB)*
Referenzprobenfreie Quantifizierung von Elementtiefengradienten in Cu(In, Ga)Se₂-Absorbern durch Röntgenfluoreszenzanalyse unter streifendem Einfall
- 13.50–14.10 *R. Tagle u.a. (Bruker Nano GmbH)*
Von der 2D- zur 3D-Elementanalytik auf der μ m- bis cm-Skala
- 14.10–14.25 Kaffeepause
- 14.30–15.50 *Leitung: M. Krumrey*
- 14.30–14.50 *B. Müller (BAM)*
Röntgenrefraktometrie: Prinzipien und Anwendungen
- 15.10–15.30 *I. Tiseanu u.a. (National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics)*
Advanced X-Ray imaging techniques for non-destructive analysis of fusion materials
- 15.30–15.50 *C. Seim u.a. (TU Berlin)*
Laboratory Full-Field Transmission X-Ray Microscopy and Applications
- 15.50–16.00 Schlusswort
R. Wedell
- Am Mittwoch, 20.11.2013, findet an der TU Berlin im Berlin Laboratory for innovative X-Ray Technologies BliX in der Zeit von 14.00–17.00 Uhr ein Workshop der Arbeitsgruppe „Analytische Röntgenphysik“ statt. Anmeldungen bitte direkt an Frau Remus (remus@physik.tu-berlin.de). Nähere Informationen zum Programm unter: www.axp.tu-berlin.de/ag_kanngiesser